

アナログ集積回路研究会 第10回講演会

LSIテストの概要と最近のテストの話題



講師: 甲元芳雄氏

(株)アドバンテスト 商品企画統括部マーケティング・グループ リーダ

日時: 1月30日(金) 9:30~11:30

会場: 群馬大学工学部総合研究棟 506号室

LSIは開発時の機能チェック、ウエハー上でのチェック、完成品のチェックと幾多の関門を経て製品となります。

また膨大な内容と企業秘密の詰まったLSIを理解し、短時間で検査を終えなければ一瞬の遅れが大損害をもたらします。

LSIの閻魔大王、甲元氏、地獄に落ちるか? 娑婆に出られるか? 閻魔帳(テストプログラム)で一目瞭然、悪事(bug)一つも看過せず。

LSIテストを通して今後のデバイス界はどのように展開されるのか? 激戦地アメリカでの経験豊富な氏の快刀乱麻な講演に期待です。

さあ、知識のbugをこの講演でfixしてもらいましょう。



講演内容:

- 1 デバイステストの基礎、テストシステムの概要
- 2 高速のテスト、RF IC(高周波用IC)のテスト
- 3 ICカードのテスト
- 4 BIST(built in self test)/SCAN
- 5 EDA(Electronic Design Automation)とのリンク

甲元芳雄氏※自称27歳独身(著書より)?

対象: **本学学生、教職員、学外**の関心のある方

問合せ: 0277-30-1789 アナログ集積回路研究会事務局